

電磁波シールド材・吸収材評価 (企業ご自身で利用できる機器の提供開始)

電子部品の小型化・高性能化、機器のデジタル化などが進む中、電磁波ノイズの問題が顕著になっています。その対策のため、電磁波シールド材・吸収材の開発が急速に進められています。

東京都立産業技術研究センター（都産技研）では、電磁波シールド材・吸収材の開発において必要不可欠な測定評価のための機器を整備し、皆様にご利用いただけるようになりました。

お客様ご自身で、測定を行うことができます（有料）。

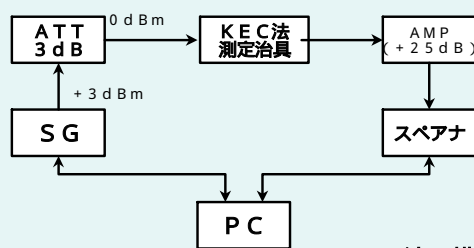
電磁波シールド材、吸収材の評価について

電磁波シールド材・吸収材の評価には、各種の方法が提案されており、電界・磁界・遠方界・近傍界・試料の形状等によって評価方法は異なります。

都産技研では、下記の3種類の評価法による測定が可能です。

KEC法：電磁波シールド材を対象に、近傍界の電界及び磁界のシールド効果の評価に適しています。

(周波数帯域 100 kHz ~ 1 GHz、試料サイズ 110mm x 100mm)



KEC法の構成



測定治具

同軸管法：遠方界の平面波におけるシールド効果及び吸収効果の評価

マイクロストリップライン法：近傍界における抑制効果の評価

<http://www.iri-tokyo.jp/>

【お問い合わせ先】 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

経営企画本部経営情報室 澤近 洋史 TEL 03-3909-2431 FAX 03-3909-2591

研究開発部エレクトロニクスグループ 三上 和正 TEL 03-3909-2151 FAX 03-3909-2590